

発行資料の分類コードと入手方法

当センターでは、定期刊行物の「RCJ会報」の他に、電子部品の信頼性に関する規格、電子部品・電子機器の信頼性に関する調査試験研究成果報告書を発行しておりますのでご利用下さい。

1. コードによる分類

当センター発行の規格、調査試験研究成果報告書は、次のコードにより分類しています。

(1) 電子部品の信頼性に関する規格 (RCJS)

$$\frac{RCJS}{①} - \frac{○○○○}{②} - \frac{○○○○}{③}$$

- ① RCJ規格であることを示す記号。
- ② 規格制定順の追番号を表す。
- ③ 規格制定年を西暦で示す。

(2) 電子部品・電子機器の信頼性に関する調査試験研究成果等の刊行物

$$\frac{R}{①} - \frac{○○}{②} - \frac{○○}{③} - \frac{○○}{④}$$

- ① 当センターの刊行物であることを示す。
- ② 発行した年を二桁で示す。
- ③ D：電子デバイス、E：環境試験、R：信頼性、M：測定方法、P：受動部品（C、Rなど）
Q：認証関係、S：半導体デバイス
なお、必要な場合は上記の分類コードの二つを組み合わせて表す。
(例) ES：半導体デバイスの環境試験
RS：半導体デバイスの信頼性
- ④ ③による分類の中で年度ごとによる発行順の追番号を二桁の数で示す。

2. 入手方法と頒布価格

当センター発行資料は、一般の書店では取り扱っておりません。
ご入用の向きは、直接下記へご注文下さい。
なお、郵送の場合の送料（実費）を別途申し受けます。

〒104-0041 東京都中央区新富 1-7-4 阪和別館ビル 5階
財団法人 日本電子部品信頼性センター 総務部
(TEL： 03-6280-5601 FAX： 03-6280-5602)

3. 代金の支払い方法

ご注文あり次第、現品に請求書を添えて送付いたしますので、受領されましたら請求書に指定した銀行口座に代金をお振り込み下さい。

1. 定期刊行物

名 称	頒 布 価 格	備 考
R C J 会 報	年4回発行 一部につき420円	年間予約購読をお勧めします。

2. 電子部品の信頼性に関する規格及びガイドライン

分類コード 番 号	名 称	頒布価格 (円)	
		会 員	一 般
SQA-4-01	ASIC 及び IC の製造業者認定と総合的品質管理(TQM)に関する ガイドライン	5,250	6,300
SQA-6-01	半導体デバイス規格研究委員会成果報告書 CECC 0080X I.CECC 認証取得企業のための TQM ガイドライン (一次仮訳) II.IEC/SC47A/373/CDV 製造業者認証と品質マネー ジメントのための手順 (仮訳速報)	2,100	3,150
SQA-7-01	技術認証スケジュール調査資料	2,100	3,150
SQA-9-01	IECQ 制度下におけるプロセス (工程) 認証	4,200	8,400
SQA-10-01	エレクトロニックプロセス認証規格 (仮訳)	4,200	8,400
SQA-11-01	部品マネジメント計画書のためのガイド(仮訳) I E C Q 001007-1-1 (Revision E)	2,100	3,150
SQA-12-01	デバイス規格研究委員会調査報告書 IEC QC 001007-1-2 (Revision G) 第1-2部 航空宇宙産業： 製造業者指定温度範囲外で半導体デバイスを使用する ためのガイド (仮訳) IEC QC 001007-1-3 (Revision G) 第1-3部 航空宇宙産業： 電子機器の信頼性審査のためのガイド (仮訳)	4,200	8,400
SQA-13-01	デバイス規格研究委員会調査報告書 電子機器の新しい信頼度予測方法-PRISM- <u>(CD版のみ)</u>	5,250	7,350

3. 電子部品・電子機器の信頼性に関する調査試験研究成果の刊行物

分類コード 番号	名 称	頒布価格 (円)	
		会 員	一 般
R-8-ES-01	静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書	3,150	4,200
R-8-EC-01	電子部品の故障率の基準条件及び換算のためのストレスモデル	3,150	5,250
R-8-EC-02	信頼性ストレススクリーニング	3,150	5,250
R-9-ES-01	ESD (静電気放電) に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究報告書	7,350	9,450
R-10-ES-01	ESD (静電気放電) に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究 (上) －半導体デバイスの静電気破壊とその周辺－	3,150	6,300
R-10-ES-02	ESD (静電気放電) に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究 (下) －静電気対策用資材・機器とその周辺－	5,250	8,400
R-11-ES-01	平成11年度 静電気研究委員会研究成果報告書	5,250	8,400
R-12-ES-01	平成12年度 静電気研究委員会研究成果報告書	5,250	8,400
R-13-ES-01	平成13年度 静電気研究委員会研究成果報告書 －電子デバイスの ESD 障害防止対策及び静電気測定器活用ガイド－	5,250	8,400
R-1-RS-01	VLSI 1M ビット DRAM の信頼性試験に関する調査研究成果報告書	3,150	4,200
R-2-RS-01	VLSI 1M ビット DRAM の信頼性試験 (その2) に関する調査研究成果報告書	3,150	4,200
R-2-RS-02	L S I の故障モデル式と加速寿命試験に関する調査研究成果報告書 <u>(C D 版のみ)</u>	5,250	8,400
R-3-RS-01	VLSI 4M ビットマスク ROM の信頼性試験に関する調査研究成果報告書	4,200	5,250
R-4-RS-01	応力と半導体集積回路の信頼性に関する調査研究成果報告書	7,350	9,450
R-4-RS-02	VLSI 4M ビットマスク ROM の信頼性試験に関する調査研究成果報告書 (その2)	4,200	5,250

分類コード 番号	名 称	頒布価格 (円)	
		会 員	一 般
R-5-RS-01	VLSI 1Mビットフラッシュメモリの信頼性試験に関する調査研究成果報告書 (I)	4,200	6,300
R-6-RS-01	VLSI 1M ビットフラッシュメモリの信頼性試験に関する調査研究成果報告書 (II)	4,200	6,300
R-6-RS-02	半導体集積回路におけるインプロセス信頼性技術に関する調査研究成果報告書	8,400	10,500
R-7-RS-01	半導体故障物理研究委員会中間報告書	3,150	4,200
R-8-RS-01	半導体故障物理研究委員会成果報告書	5,250	7,350
R-9-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 －最新フラッシュメモリ技術の信頼性－	6,300	8,400
R-10-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 －最新フラッシュメモリ技術及びLSI加工応用 マイクロマシン技術の信頼性－	5,250	7,350
R-11-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 －薄層ゲート酸化膜の信頼性を中心として－	5,250	8,400
R-12-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書	5,250	8,400
R-13-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 －最新 VLSI 要素技術 (酸化膜と多層配線) の故障物理と信頼性 から見た Si 半導体技術の限界－	5,250	8,400
R-14-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 －最新 VLSI 要素技術 (酸化膜と多層配線) の信頼性と微細化 限界－	5,250	8,400
R-15-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 －最新 ULSI 要素技術の故障物理とバーンイン技術－	5,250	8,400
R-16-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 －バーンイン技術と最新 ULSI 信頼性の話題－	5,250	8,400
R-17-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 －最新 ULSI 故障物理及び最新不揮発性メモリ技術と信頼性	5,250	8,400
R-18-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 － 次世代技術ロードマップと信頼性課題 －	5,250	8,400
R-19-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 － 負バイアス温度不安定性現象 (NBTI) を中心として －	5,250	8,400

R-20-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 － 負バイアス温度不安定性現象 (NBTI) と ランダム・テレグラフ・シグナル (RTS) ノイズ現象 －	5,250	8,400
------------	---	-------	-------

前記の〈規格及び刊行物〉以外に在庫がなくなりましたものは、当センターにおいて下されば閲覧することができますのでご利用下さい。

4. その他

名 称	頒 布 価 格	
	会 員	一 般
RCJ 第4回 電子デバイスの信頼性シンポジウム予稿集	3,150	4,200
RCJ 第6回 電子デバイスの信頼性シンポジウム予稿集	4,200	5,250
RCJ 第7回 信頼性シンポジウム予稿集	9,450	10,500
RCJ 第8回 信頼性シンポジウム予稿集	9,450	12,600
RCJ 第9回 信頼性シンポジウム予稿集	9,450	12,600
RCJ 第10回 信頼性シンポジウム予稿集	9,450	12,600
RCJ 第11回 信頼性シンポジウム予稿集	9,450	12,600
RCJ 第12回 信頼性シンポジウム発表論文集	9,450	12,600
RCJ 第13回 信頼性シンポジウム発表論文集	9,450	12,600
RCJ 第14回 信頼性シンポジウム発表論文集 (CD版のみ)	7,350	10,500
RCJ 第15回 信頼性シンポジウム発表論文集	9,450	12,600
RCJ 第16回 信頼性シンポジウム発表論文集	9,450	12,600
RCJ 第17回 信頼性シンポジウム発表論文集	9,450	12,600
RCJ 第18回 信頼性シンポジウム発表論文集	9,450	12,600
RCJ 第19回 信頼性シンポジウム発表論文集	9,450	12,600
RCJ ESDコーディネータ資格認証セミナーテキスト第5版(平成19年6月) IEC 技術報告書 タイプ2 IEC 61340-5-1 5-1 静電気現象からの電子デバイスの保護—一般的要求事項 IEC 技術仕様書 IEC 61340-5-2 5-2 静電気現象からの電子デバイスの保護—ユーザガイド 【参考】 IEC 規格 IEC 61340-4-1 4-1 特定応用のための標準的試験方法—床被覆材と施行床の静電的性質 〃 〃 〃 〃 〃 〃 —床被覆材と施行床の電気抵抗	5,250	7,350